

参加者
募集

平成29年度 第20回

シーズ・研究内容紹介



●シーズとは：大学、研究機関、企業、団体等が持つ「技術、ノウハウ、アイデア、人材、設備」などの資源のこと。
語源は英語の「種（シーズ：seeds）」。「簡潔に言い換えると」（大学等が）「できること」。



講師：高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科

よこ やま ゆう た 横山 有太 講師

〈講師プロフィール〉

筑波大学第3学群工学基礎学類応用物理主専攻 卒業（2007年）
筑波大学大学院数理物質科学研究科物質創成先端科学専攻 博士前期（修士）課程修了（2009年）
筑波大学大学院数理物質科学研究科物質創成先端科学専攻 博士後期課程修了（工学）（2012年）
独立行政法人日本原子力研究開発機構 博士研究員（2012年～）
成蹊大学理工学部物質生命理工学科 助教（2014年～）
高知工業高等専門学校ソーシャルデザイン工学科 講師（2016年～）

〈テーマ〉

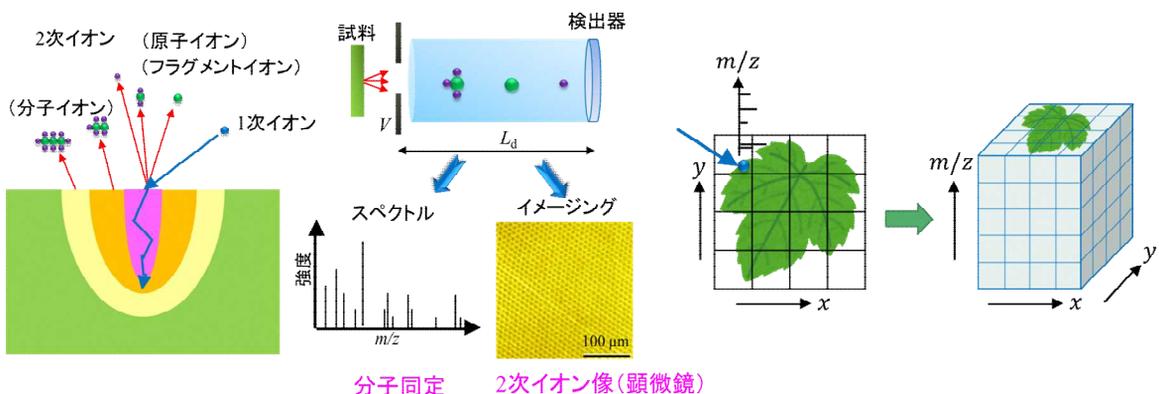
隠れた情報を引き出す－質量分析と多変量解析を用いたデータ解析手法について－

日時：2018年2月21日 水 18:30～20:00

場所：高知県産学官民連携センター ココプラ

◆テーマ概要（講師より）

質量分析とは、測定したい試料を原子・分子レベルの大きさのイオンにし、その重さや数を測定することで、その試料に含まれる元素の種類や量を調べる方法です。なかでも、飛行時間型二次イオン質量分析法（ToF-SIMS）と呼ばれる手法は、試料表面の形状と、そこにどんな元素が存在するかを超高感度で測定することができます。その反面、得られるデータは非常に膨大であり、本当に知りたかった情報がデータの山の中に埋もれてしまうことがあります。このような場合、多変量解析と呼ばれるデータ解析手法を用いることで、隠れた情報を引き出せることがあります。例えば、肉眼や通常の顕微鏡等では見ることのできない局所的な汚染や、検出強度が非常に弱い極微量成分を分離することが可能です。発表では、ToF-SIMSによるポリマーや生体分子、植物試料の測定例を中心に、隠れた情報を引き出す解析方法をご紹介します。



飛行時間型二次イオン質量分析(ToF-SIMS)の概略図

特に

こんな方にオススメ

- ▶ 質量分析やデータ解析に関心のある企業・団体の皆さま
- ▶ 農産物の付加価値を高めたい企業・団体等の皆さま

キーワード

- ▶ 質量分析、データ解析、植物



<開催場所>

高知県産学官民連携センター ココプラ 交流スペース

高知県立大学・高知工科大学永国寺キャンパス 地域連携棟 1階（高知市永国寺町6-28）



- 会場併設の駐車場（無料）をご利用いただけますが、数に限りがあります。
- 周辺に有料の駐車場もございますが、来場の際は、公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。

※[公共交通機関をご利用の場合]

- ・JR 高知駅より徒歩15分
- ・路面電車 大橋通駅より徒歩7分

<申込方法>

FAXもしくは「ココプラ」ホームページよりお申し込みください。

<http://www.kocopla.jp/>

「取組み情報」の「シーズ・研究内容紹介」をクリック→参加希望のイベントを選んでください。



ココプラHP QRコード

<申込締切>

2018年2月19日（月）※当日参加も可能ですが、申し込みされた方を優先させていただきます。



<申込、お問い合わせ先> 高知県産学官民連携センター「ココプラ」

〒780-8515 高知市永国寺町6-28

（高知県立大学・高知工科大学永国寺キャンパス 地域連携棟 1階）

TEL. 088-821-7111 FAX. 088-821-7112 E-MAIL. info@kocopla.jp

『第20回シーズ・研究内容紹介「隠れた情報を引き出す－質量分析と多変量解析を用いたデータ解析手法について－」』

FAX用 申込用紙

フリガナ 氏名			
所属		役職	
電話番号		メール アドレス	

※いただいた個人情報は、当該事業および県の産業振興計画に関する情報提供以外には使用いたしません。

FAX:088-821-7112

